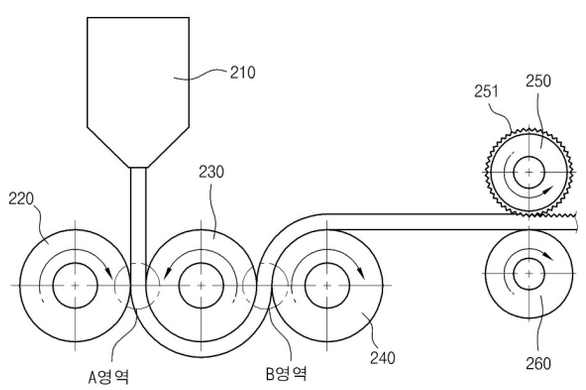
■ 자료제공 : 특허법인 대아

인각률이 향상된 광학필름 제조방법 (Preparing Optical Film Improved Engraving Efficiency)

출원번호(일자) : 10-2009-0135860 (2009.12.31)
공개번호(일자) : 10-2011-0078935 (2011.07.07)
출원인 : 웅진케미칼 주식회사

요약

본 발명은 인각률이 향상된 광학필름 제조방법으로서 보다 상세하게는 광학필름을 제조하는 데 있어서, 고분자 수지를 용융 압출하는 단계; 상기 용융된 수지를 가압롤을 이용하여 필름으로 형성하는 단계; 상기 형성된 필름을 냉각하는 단계; 및 상기 냉각된 필름을 패턴롤에 의해 원하는 형상으로 인각하는 단계를 포함하는 인각률이 향상된 광학필름 제조방법에 관한 것이다.

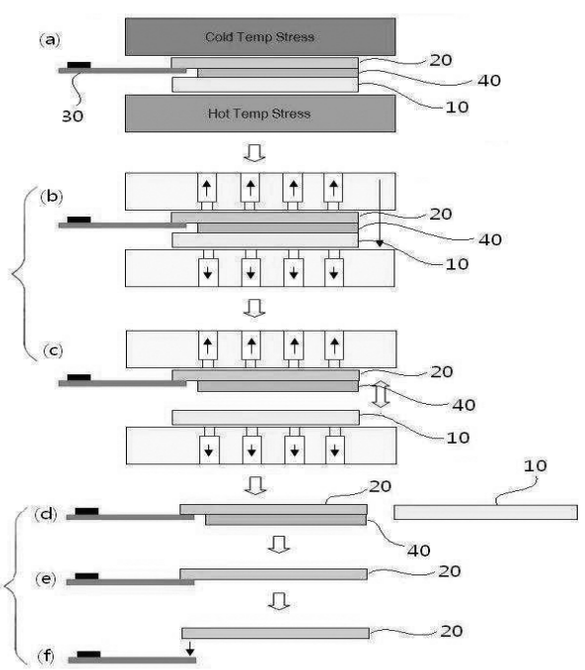


발명의 명칭 터치스크린패널의 디스플레이 모듈 재생을 위한 광학투명접착제 분리제거 장치 및 그 방법

출원번호(일자) : 10-2010-0008434 (2010.01.29)
공개번호(일자) : 10-2011-0088772 (2011.08.04)
출원인 : 주식회사 에스티에스

요약

터치스크린패널의 디스플레이 모듈 재생을 위한 광학투명 접착제 분리제거 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 장치는 회로기판이 연결된 투명전극패턴, 프론트 윈도우, 상기 투명전극패턴과 상기 프론트 윈도우 사이에 접착층을 포함한 터치스크린 패널의 부품을 분리 및 재생하기 위한 장치로서, 상기 터치스크린 패널의 일면을 가열하는 가열부; 상기 터치스크린 패널의 타면을 냉각하는 냉각부; 및 상기 가열부과 상기 냉각부의 온도를 제어하여 상기 접착층의 일면의 접착력이 와해되도록 하는 제어부를 포함한다.
이에 의해, 합착 불량으로 인해 소모되는 막대한 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 이로 인한 환경오염을 줄일 수 있다. 또한 별도의 화학처리를 거치지 않기 때문에 생산성을 획기적으로 향상시킬 수 있다.

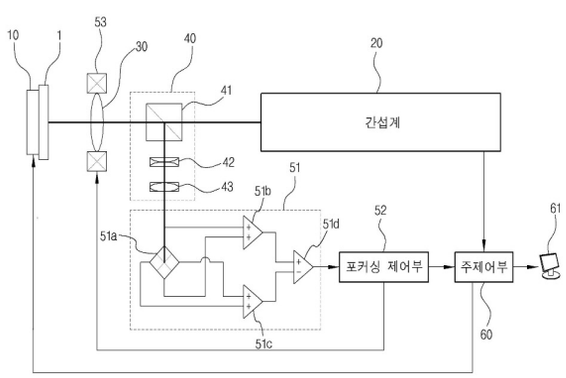


발명의 명칭 광학식 복합진단 측정 장치 및 방법 (Optical Composite Measuring Apparatus And Method)

출원번호(일자) : 10-2010-0013336 (2010.02.12)
공개번호(일자) : 10-2011-0093348 (2011.08.18)
출원인 : 연세대학교 산학협력단, 서강대학교 산학협력단

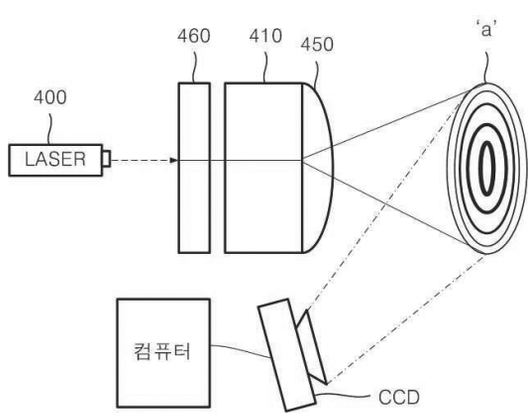
요약

본 발명은 광학식 복합진단 측정 장치 및 방법에 관한 것으로서, 참조데이터를 얻기 위한 선행 측정이 불필요하고, 반사율 등의 이질성을 갖는 측정대상물에 대해서도 실시간으로 정확한 측정이 가능해지는 광학식 복합진단 측정 장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. 상기한 목적을 달성하기 위하여, 측정대상물을 이동시키는 전동스테이지; 측정대상물의 표면에 레이저광을 조사하고 측정대상물로부터 반사되는 반사광을 입력받아 간섭신호를 출력하는 간섭계; 상기 간섭계에서 조사된 레이저광을 측정대상물의 표면에 집광하여 초점을 형성하는 대물렌즈; 상기 간섭계로부터의 레이저광을 대물렌즈 쪽으로 안내하고 상기 반사광을 간섭계와 하기 오토포커싱 장치 쪽으로 분리하여 안내하는 광학계; 상기 광학계에 의해 안내되는 반사광을 검출하여 측정대상물의 이동 동안 오토포커싱을 수행하는 오토포커싱 장치; 및 측정대상물의 이동을 제어하기 위한 제어신호를 상기 전동스테이지로 출력하고 상기 오토포커싱 장치로부터 레이저광의 초점이 측정대상물의 표면에 일치되도록 하기 위한 되먹임 조절용 에러 신호를 입력받아, 상기 간섭계로부터 입력되는 간섭신호와 상기 되먹임 조절용 에러 신호를 기초로 측정대상물의 표면 정보 및 광학적 정보를 획득하는 주제어부를 포함하는 광학식 복합진단 측정 장치가 개시된다.



발명의 명칭 광학식 표면 형상 측정 장치 (Optical Surface Profilometer)

출원번호(일자) : 10-2010-0003499 (2010.01.14)
공개번호(일자) : 10-2011-0083328 (2011.07.20)
출원인 : 경북대학교 산학협력단

요약

본 발명은 액정이 주입된 패브리 페롯 공진계를 이용한 광학식 표면 형상 측정 장치에 관한 것이다. 상기 광학식 표면 형상 측정 장치는, 액정이 주입된 패브리 페롯 공진계; 상기 패브리 페롯 공진계로 간섭성을 갖는 광을 제공하는 광원; 상기 패브리 페롯 공진계의 간섭 패턴 출사면에 배치되는 볼록 렌즈;를 구비하여, 상기 광원으로부터 제공되는 간섭성을 갖는 광은 패브리 페롯 공진계로 입사되고, 광이 입사됨에 따라 상기 패브리 페롯 공진계는 공진 모드에 의해 생성되는 간섭 패턴을 출사하며, 상기 간섭 패턴은 동일한 중심을 갖는 다수 개의 원형 프린지들(fringes)이 비선형적으로 배치되어 구성된다. 상기 액정층에 전압이 인가됨에 따라 유효굴절률이 변화되어 패브리 페롯 공진계의 공진 모드 조건이 변하게 되고, 그 결과 간섭 패턴의 직경이 함께 변하게 된다. 이러한 간섭 패턴들을 이용하여 측정 대상물 표면의 3차원 형상을 측정하게 된다.